### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ** 

## Аналитические приборы и методы в электронике

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.03.04 25 00.plx

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого		
Недель	1	6			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	24	24	24	24	
Практические	24	24	24	24	
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25	
Итого ауд.	48,25	48,25	48,25	48,25	
Контактная работа	48,25	48,25	48,25	48,25	
Сам. работа	51	51	51	51	
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75	
Итого	108	108	108	108	

#### Программу составил(и):

д. физ-мат.н., проф., Трубицын Андрей Афанасьевич

#### Рабочая программа дисциплины

#### Аналитические приборы и методы в электронике

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

составлена на основании учебного плана:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 22.05.2025 г. № 11 Срок действия программы: 2025-2029 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

# Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_\_\_2026 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_ \_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_ 2028 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

#### Промышленной электроники

Протокол от	_ 2029 г. №
Зав кафеллой	

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1	Целью является изучение методов прикладной математики моделирования физических процессов.
1.2	Задачи дисциплины:
1.3	получение теоретических знаний о методах прикладной математики;
1.4	приобретение практических навыков в применении методов прикладной математики;
1.5	□ разработка и применение компьютерных программ моделирования электронных устройств, физических процессов и явлений;
1.6	реализация технических заданий на проведение моделирования приборов электроники

	2. МЕСТО ДИСЦИ	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
П	Цикл (раздел) ОП: Б1.В						
2.1	2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:						
2.1.1	Схемотехника						
2.1.2	Тепловые процессы в эл	ектронике					
2.1.3	Электромагнитные поля	и волны. Ч.2					
2.1.4	Твердотельная электрон	ика					
2.1.5	Технологические процес	сы наноэлектроники					
2.1.6	Цифровая обработка сиг	налов в электронных устройствах					
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:						
2.2.1	Выполнение и защита в	ыпускной квалификационной работы					
2.2.2	Преддипломная практик	a					
2.2.3	Производственная практ	тика					
2.2.4	САПР устройств электро	ОНИКИ					
2.2.5	Тонкопленочные структ	уры в электронике					
2.2.6	Физические основы мет	одов анализа вещества					
2.2.7	Масс - спектрометрия в	органической химии					
2.2.8	Современные технологи	и MEMS компонентов					

# 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

#### ПК-2.1. Анализирует научные данные, результаты экспериментов и наблюдений

#### Знать

как анализировать научные данные, результаты экспериментов и наблюдений

#### Уметь

анализировать научные данные, результаты экспериментов и наблюдений

#### Владеть

умением анализировать научные данные, результаты экспериментов и наблюдений

# ПК-2.2. Систематизирует и обобщает результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

#### Знать

как систематизировать и обобщать результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

#### Уметь

систематизировать и обобщать результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

#### Владеть

систематизацией и обобщением результатов исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представлением материалов в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

#### В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

### 3.1 Знать:

3.1.1	проблемы применения методов экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок;
3.2	Уметь:
3.2.1	оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности предлагаемых методик экспериментального исследования параметров установок;
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками по оценке риска рекомендуемых методик

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАН					
Код	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр /	Часов	Компетен-	Литература	Форма
занятия	Раздел 1. Спектроскопия обратно	Курс		ЦИИ		контроля
	рассеянных ионов низких энергий					
1.1	Сущность масс-спектрометрического метода и	7	0			
1.1	решаемые задачи. Принцип масс-анализа. Типы	,				
	масс-анализаторов. /Тема/					
1.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3		Контрольные
1.2	Лекция 1/Лек/	/		ПК-2.1-У		вопросы
				ПК-2.1-У		вопросы
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-3		
1.3		7	2	ПК-2.2-В		0
1.3	занятие 1 /Пр/	/	2			Отчет
				ПК-2.1-У ПК-2.1-В		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-У		
	100			ПК-2.2-В		
1.4	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3		Устный опро
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
1.5	Количественный анализ. Качественный анализ.	7	0			
	Конструкция спектрометра Основные узлы					
	спектрометра. Характеристики метода /Тема/					
1.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3		Контрольные
				ПК-2.1-У		вопросы
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
1.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3		Отчет
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
1.8	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3		Устный опро
	_			ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
	Раздел 2. Масс-спектрометрия вторичных					
	ионов	<del> </del>				
2.1	Сущность масс-спектрометрического метода и	7	0			
	решаемые задачи. Принцип масс-анализа. Типы					
	масс-анализаторов. /Тема/	1	1			1

2.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В		Контрольные вопросы
				ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		
2.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3		Отчет
				ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		
2.4	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	7	Устный опрос
2.5	Количественный анализ. Качественный анализ. Конструкция спектрометра Основные узлы спектрометра. Характеристики метода /Тема/	7	0			
2.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	]	Контрольные вопросы
2.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Отчет
2.8	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	7	Устный опрос
	Раздел 3. Дифракция рентгеновских лучей					
3.1	Дифракционные методы исследования. Типы кристаллических решеток. Индексы Миллера. /Тема/	7	0			
3.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	]	Контрольные вопросы
3.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Отчет
3.4	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Y	Устный опрос
3.5	Дифракция рентгеновских лучей. Условия Лауэ. Условие Вульфа-Брэгга. Рентгеноструктурный анализ. /Тема/	7	0			

3.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПИ 2.1.2	I/ overme over ver vo
				ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Контрольные вопросы
3.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Отчет
3.8	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Устный опрос
	Раздел 4. Дифракция медленных электронов				
4.1	Электронная пушка. Дифрактометр медленных электронов. Физические основы метода. /Тема/	7	0		
4.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Контрольные вопросы
4.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Отчет
4.4	/Cp/	7	5	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Устный опрос
4.5	Уравнение дифракции медленных электронов. Методы расшифровки дифракционных картин. /Тема/	7	0		
4.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Контрольные вопросы
4.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Отчет
4.8	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Устный опрос
	Раздел 5. Электронная оже-спектроскопия				
5.1	Распределение вторичных электронов по энергям. Типы энергоанализаторов электронов. Цилиндрический зеркальный анализатор / Тема/	7	0		

				1	1	1
5.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У		Контрольные вопросы
5.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-2.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У		Отчет
				ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		
5.4	/Cp/	7	5	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Устный опрос
5.5	Физика Оже-процесса. Оже-спектрометр. Количественная Оже-спектроскопия. /Тема/	7	0			
5.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Контрольные вопросы
5.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Отчет
5.8	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Устный опрос
	Раздел 6. Фотоэлектронная спектроскопия					
6.1	История метода. Полусферический анализатор энергий электронов. Физические основы метода. /Тема/	7	0			
6.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Контрольные вопросы
6.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Отчет
6.4	/Cp/	7	5	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Устный опрос
6.5	Фотоэлектронный спектрометр. Обозначение фотоэлектронных линий. Ширина фотоэлектронной линии. /Тема/	7	0			

6.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-2.1-3	Контрольные
				ПК-2.1-У	вопросы
				ПК-2.1-В	1
				ПК-2.2-3	
				ПК-2.2-У	
				ПК-2.2-В	
6.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-2.1-3	Отчет
				ПК-2.1-У	
				ПК-2.1-В	
				ПК-2.2-3	
				ПК-2.2-У	
				ПК-2.2-В	
6.8	/Cp/	7	4	ПК-2.1-3	Устный опрос
				ПК-2.1-У	
				ПК-2.1-В	
				ПК-2.2-3	
				ПК-2.2-У	
				ПК-2.2-В	
6.9	/ИКР/	7	0,25		Вопросы к
					зачету
6.10	/Зачёт/	7	8,75		Вопросы к
					зачету

#### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Аналитические приборы и методы в электронике»»).

6.	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
	6.1. Рекомендуемая литература				
	6.2. Перечень ресурсов и	нформационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1					
	6.3 Перечень программи	ного обеспечения и информационных справочных систем			
	6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства				
	Наименование	Описание			
MATLAB	R2010b	Бессрочно. Matlab License 666252			
Mathcad U	Mathcad University Classroom Бессрочно. Лицензия на ПО РКG-7517-LN, SON – 2469998, SCN – 8A1365510				
Операцио	онная система Windows 7	Лицензионное ПО			
	6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовой портал Гл	APAHT.PY http://www.garant.ru			
6.3.2.2	6.3.2.2 Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru				

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
1	109 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.						
2	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.						

#### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Методические указания дисциплины «Аналитические приборы и методы в электронике»») тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей ЗАВЕДУЮЩИМ Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей 30.08.25 19:02 (MSK) Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

ЗАВЕДУЮЩИМ выпускающей КАФЕДРЫ

ПОДПИСАНО

Простая подпись

Простая подпись

30.08.25 19:02 (MSK)